



**POLITECNICO
DI MILANO**

Coordinamento Scientifico

Prof. Michele D'Amico
Dipartimento di Elettronica e
Informazione
Prof. Sergio Pignari
Dipartimento di Elettrotecnica

Segreteria IEEE EMC-S IT Chapter

Ing. Luca Di Rienzo
Dipartimento di Elettrotecnica
E-mail: luca.dirienzo@polimi.it
Phone: +39 02 2399 3748
Fax: +39 02 2399 3703

Registrazione

La partecipazione è gratuita ma è
richiesta l'iscrizione all'evento, **entro
il 17-02**

Modalità di iscrizione

Via e-mail, fax o telefono alla
Segreteria dell'IEEE EMC-S IT
Chapter

Sito Web

<http://www.etec.polimi.it/emc-chap-it>

La giornata avrà luogo presso il

Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica e
Informazione
Sala Conferenze
Via Ponzio 34/5 - Milano

Come raggiungere il Politecnico

<http://www.etec.polimi.it/emc-chap-it/venue.html>

Con la sponsorizzazione di:



Agilent Technologies



**Electromagnetic Compatibility Italy Chapter
Instrumentation & Measurement Italy Chapter**

Giornata di studio su:

**L'INCERTEZZA DI MISURA NELLA COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA**

Politecnico di Milano, 20 febbraio 2009

PROGRAMMA

9:00 – 9:45	Registrazione
9:45 – 10:00	Saluto di benvenuto Prof. Gianantonio Magnani, Direttore del Dip. Elettronica e Informazione Prof. Michele D'Amico, Dip. Elettronica e Informazione Prof. Sergio Pignari, Dip. Elettrotecnica – IEEE EMC-S IT Chapter Chair
10:00 – 10:25	Incerteza di misura: concetti di base Prof. Roberto Ottoboni, Dip. Elettrotecnica, Politecnico di Milano
10:25 – 10:50	Valutazione dell'incerteza di misura in ambito EMC Prof. Carlo Carobbi, Dip. Elettronica e Telecom., Università di Firenze
10:50 – 11:15	Intervallo caffè
11:15 – 11:40	Accreditamento di procedure di prova per la misura delle emissioni radiate del sistema ferroviario Ing. Alessio Gaggelli, Trenitalia S.p.A.
11:40 – 12:05	Il problema della riferibilità della strumentazione usata nelle misure EMC Ing. Michele Borsero, INRIM – VicePresidente CEI TC210
12:05 – 12:30	Uncertainty in RF emission measurements: revision of CISPR 16-4-2 Ing. Manfred Stecher, Rohde&Schwarz – Chairman CISPR A
12:30 – 14:00	Buffet
14:00 – 14:25	L'incerteza di misura nell'accreditamento SINAL dei laboratori EMC Ing. Bruno Audone, SINAL
14:25 – 14:50	Le sorgenti di incerteza in una catena di misura EMC Ing. Giancarlo Borio, LACE, Corep – Segretario CEI SC77B
14:50 – 15:15	Il "Costo dell'incerteza" nella gestione di un laboratorio Ing. Alessandro Zuccato, CreiVen
15:15 – 15:40	Intervallo caffè
15:40 – 16:05	L'evoluzione delle norme EMC per includere l'incerteza di misura Ing. Beniamino Gorini, Alcatel Lucent – Chairman CISPR H Ing. Mariano Giunta, TelecomItaliaLab – Segretario CEI SC210A
16:05 – 16:30	Strumenti e allestimenti di prova per ridurre l'incerteza Dott. Domenico Festa, IBD – Presidente CEI SC77B
16:30 – 16:55	Propagazione del rumore nei sistemi di misura EMI nel dominio del tempo Ing. Diego Bellan, Prof. Sergio Pignari, Dip. Elettrotecnica, Politecnico di Milano
16:55 – 17:30	Quesiti e dibattito Moderatore: Dott. Domenico Festa, IBD – Presidente CEI SC77B



INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT